



OptoTech

μShape OWI

Phasenschiebende Auswertungssoftware



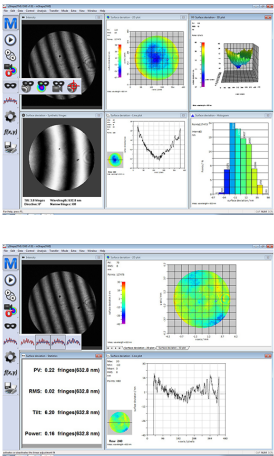
μShape OWI ist ein flexibles Werkzeug zur Qualitätskontrolle in der Optikfertigung und im Prüflabor. Es analysiert Abweichungen zur Sollform und visualisiert die Ergebnisse für den direkten Vergleich mit Zeichnungsvorgaben. Die Software ist intuitiv bedienbar, individuell anpassbar und integriert sich optimal in Ihren Arbeitsstil. Sie steuert und dokumentiert Messprozesse, gewährleistet Transparenz und ermöglicht den Export der Daten zur CNC-Steuerung. Leistungsstarke Algorithmen sorgen für präzise Analysen und flexible Anpassungen an Ihre Messaufgaben.



OptoTech

Technische Daten

	µShape OWI
Anwendung	Phasenschiebende Auswertungssoftware für Interferometer
Disclaimer	Änderungen der Daten ohne Ankündigung vorbehalten. Wenden Sie sich zur Klärung von Einzelheiten bitte an OptoTech.





Highlights

- Verschiedene Programm-Modi: Getrennte Darstellung des Kalibrier- und des Messprozesses in einfach umschaltbaren Programm-Modi mit integriertem Kamera-Livebild
- Vorlagen: Einfache Vorkonfiguration für verschiedenste Messaufgaben, Auswertungen und Speicherung in Form von Vorlagen (Templates)
- Datenexport: Export einzelner Parameter als Textdatei oder bestimmter Datenfelder in Binärform zur externen Weiterverarbeitung
- Protokollfunktion: Individuelle Messprotokolle mit unterschiedlichen Grafiken und variabler Messdaten-Darstellung zur Qualitätsdokumentation
- User Levels: Verschiedene Benutzerstufen mit unterschiedlichen Zugriffsrechten
- Online-Hilfe: Umfangreiche und Kontext-sensitive Online-Hilfe

Prozessmerkmale

- Messparameter: Einstellung aller Messparameter entsprechend der jeweiligen Messanordnung, jeweils getrennt für Kalibrierung und Prüflingsmessung
- Masken: Setzen geometrischer Elemente (Kreise, Ellipse, Rechtecke, Quadrate und Polygone) als Innen- oder Außenmasken in beliebiger Kombination
- Wellenfrontparameter: Einstellung aller für die Berechnung von Wellenfronten erforderlichen Parameter, z.B. Subtraktion der Kalibrierdaten, Aktivierung verschiedener Glättungs und Löcherschließmethoden, Kompensation von Justierfehlern für ebene oder sphärische Prüflinge
- Konfiguration: Skalierung des Messfeldes in Längeneinheiten; Umrechnung der Ergebnisse von Mess-Wellenlänge in Zeichnungs-Wellenlänge
- Darstellung: Grafische Anzeige der Datenfelder (Intensität, Phasenbild, Messergebnisse) als Schnitt-, 2D oder 3D-Bild, sowie aller Parameter und Statistikwerte in tabellarischer Form. Textdarstellung der Statistikwerte, DIN- und ISO-Parameter, Zernike- und Seidel-Koeffizienten.

Optionen

Es stehen weitere Add-On Module mit interessanten Programmiererweiterungen wie asphärische Kompensation, Multi Apertures oder MTF-Messung zur Verfügung. Diese Module können jederzeit bei Bedarf nachgerüstet werden. µShape OWI wird komplett mit einem an das Interferometer angepassten Phasenschieber (Piezoaktuator inkl. Verstärkereinheit), sowie einem Software- Dongle ausgeliefert und ist sofort betriebsbereit.